Спиридонов Д.М., Хинайш А.М.А., Вохминцев А.С., Вайнштейн И.А.

# СПЕКТРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ НАНОПОРОШКА ГЕКСАГОНАЛЬНОГО НИТРИДА БОРА

Аннотация. Спектры диффузного отражения в наноструктурированных порошках h-BN были проанализированы в рамках известного формализма Кубелки-Мунка. В предположении прямых разрешенных переходов проведена оценка ширины запрещенной зоны,  $E_g = 5.41$  эВ. Показано, что обнаруженные спектральные особенности вблизи фундаментального края поглощения являются следствием наличия в образцах примесных атомов углерода.

*Ключевые слова:* нитрид бора, диффузное отражение, Кубелка-Мунк, Тауц, ширина запрещенного зоны.

Abstract. Diffuse reflectance spectra of h-BN nanostructured powder were analyzed using the Kubelka-Munk approach. Under the assumption of direct allowed transitions, the energy gap width of  $E_g = 5.41$  eV was estimated. It was shown the observed spectral features near the fundamental absorption edge were caused by the carbon impurity and were in satisfactory agreement with known independent data.

Keywords: boron nitride, diffuse reflectance, Kubelka-Munk, Tauc, energy gap width.

### Введение

Высокий исследовательский интерес к структурам на основе гексагонального нитрида бора обусловлен его стабильностью в 2D-форме по аналогии с графеном и богатым разнообразием возможных морфологических форм (микро- и наноразмерные монокристаллы, порошок, листы, ленты, тубулярные массивы и т.д.). Наноструктурированные порошки h-BN имеют большой потенциал как основа для создания эффективных эмиттерных и детекторных сред в области излучения УФ- и видимого диапазонов [1-5]. Условия получения обуславливают широкий спектр оптических свойств [6, 7]. Известно [8], что энергетическая щель h-BN может варьироваться в широких пределах  $E_g = 3.6 - 7.1$  эВ в зависимости от способа синтеза, примесного состава и др. В этой связи изучение оптических свойств и оценка ширины запрещенной зоны в наноструктурированных порошках h-BN является актуальной целью настоящей работы.

#### Образцы и методики эксперимента

В работе исследовались образцы номинально чистого нанопорошка h-BN, синтезированного на предприятии Hongwu International Group Ltd., Гонконг. По данным анализа химического состава, представленного производителем, концентрация основных примесей углерода и кислорода в порошке не превышает 0.5 вес. %. Анализ размера частиц порошка проводился с использованием растрового электронного микроскопа Carl Zeiss Sigma VP. Структура образцов исследовалась методами рентгеновской дифрактометрии при использовании дифрактометра XPert PRO MPD фирмы PANalytical (Нидерланды).



Рисунок 1 – РЭМ-изображения нанопорошка h-BN в масштабе 200 нм

Регистрация спектров диффузного отражения порошка h-BN проводилась на спектрофотометре Lambda 35 с использованием интегральной сферы RSA-PE-20 в диапазоне длин волн от 190 до 1100 нм со скоростью сканирования 120 нм/мин. При этом спектральная ширина щели – 2 нм.

### Результаты и обсуждение

На Рисунке 1 представлено РЭМ-изображение для исследуемого порошка. Полученные снимки были проанализированы с использованием ПО SIAMS PHOTOLAB, см. Рис. 2. Показано, что размер частиц варьируется в диапазоне 40-1100 нм и может быть описан функцией логарифмически нормального распределения (сплошная линия). Максимум распределения характеризуется размером 200-300 нм.

На Рисунке 3 представлен рентгеноструктурный анализ образца. Показано, что для исследуемого порошка h-BN наблюдаются пики, которые характерны пространственной группе P63/mmc (гексагональная форма) [9]. Параметры кристаллической решетки: а = 2.502(3) Å и с = 6.72(2) Å, размер OKP – 150 Å.

Для характеристики порошка был рассчитан индекс графитизации по следующей формуле [9]:

$$GI = \frac{\Pi \pi o \mu a \partial_{b}(100) + \Pi \pi o \mu a \partial_{b}(101)}{\Pi \pi o \mu a \partial_{b}(102)}$$
(1)



Рисунок 2 – Распределение частиц порошка h-BN по размеру



Рисунок 3 – Рентгеноструктурный анализ исследуемого порошка h-BN

По полученному значению GI = 9 можно заключить, что порошок является мезографитным с упорядоченной структурой.

На Рисунке 4 приведен результат измерения спектра диффузного отражения R (штрихпунктирная линия). Видно, что поглощение падающего света в порошке происходит в спектральной области 200-500 нм. Для более длинноволнового диапазона регистрируется в основном отражение (>80 %). Дальнейший анализ полученной зависимости проводился с использованием известного выражения Кубелки-Мунка [10], связывающего значение параметра F(R) с коэффициентом оптического поглощения  $\alpha$ :

$$F(R) = \frac{(1-R)^2}{2R} \sim \alpha, \qquad (2)$$



Рисунок 4 – Спектр диффузного отражения в нанопорошке h-BN. Преобразование спектров диффузного отражения в рамках выражения F(R) Кубелки-Мунка (2): образец (сплошная линия) и спектр оптического поглощения [11] (штриховая линия)

На Рисунке 4 сплошной линией представлена расчетная зависимость F(R) от длины волны. Для сравнения также приведен спектр оптического поглощения для коммерческого порошка h-BN (Aldrich, 99%, 1 мкм) [11]. Видно, что зависимости находятся в хорошем соответствии друг с другом. Пик поглощения, наблюдаемый в области 290-310 нм, согласно [12], может быть обусловлен собственными дефектами, типа вакансии атомов азота  $V_N$ . С другой стороны, в работе [13], данный пик связывают с наличием в образцах атомов примесного углерода  $C_N$ . Известно, что дефекты подобного рода являются оптически активными и играют ключевую роль в люминесцентных процессах в различных широкозонных нитридах, например [14, 15].

Экспериментальные значения F(R) были построены в координатах Тауца [16] в предположении прямых разрешенных переходов:

$$\alpha \sim \frac{\left(hv - E_s\right)^{\frac{1}{2}}}{hv},\tag{3}$$

где hv – энергия фотонов, эВ;  $E_g$  – ширина запрещенной зоны, эВ.

По результатам анализа линеаризованного участка в области края оптического поглощения (см. Рисунок 4), ширина запрещенной зоны

составила E<sub>g</sub> = 5.41 эВ. Полученное значение вполне соответствует теоретическому 5.27 эВ для прямой запрещенной зоны в идеальном кристалле h-BN, переход H<sub>c</sub> – H<sub>v</sub> в симметричных точках зоны Бриллюэна [17]. Кроме того, указанная величина согласуется с результатами многих независимых работ (см. Таблицу 1), в которых оценки Е<sub>g</sub> для гексагонального нитрида бора были выполнены различными методами. Так, например, в работах [11, 18] оценка ширины запрещенной зоны в тонких пленках, порошках и нанотрубках h-BN проводилась на основании спектров оптического поглощения. Показано, что в этом случае E<sub>g</sub> = 5.75 - 5.82 эВ. Небольшое различие может быть обусловлено условиями синтеза образцов, их структурой, а также размерными эффектами. С другой стороны, в работе [19] для пленок h-BN, выращенных на кремниевой подложке, ширина запрещенной зоны составила 3.8 эВ. При этом авторами не указано, чем это может быть обусловлено. Близкие оценки Eg = 4.02±0.01 эВ были получены из спектров возбуждения флуоресценции в порошках h-BN [8]. Согласно данным настоящей работы указанные энергии соответствуют оптическим переходам с участием дефектных центров на основе азотных вакансий, примесей кислорода и углерода, см. пик на Рис. 5.



Рисунок 5 – Оценка ширины запрещенной зоны нанопорошка h-BN. На вставке приведена аппроксимация одним Гауссианом пика 4 эВ (штриховая линия)

	· 1 1 5	8 1	1	5 51
№	Метод оценки	Структура	E <sub>g</sub> , эВ	Литература
1	Диффузное отражение	Нанопорошок	5.41	Данная работа
2	Оптическое поглощение	Нанотрубки	5.75	[11]
3	Оптическое поглощение	Нанопорошок	5.82	[11]
4	Оптическое поглощение	Тонкие пленки	5.8	[18]
5	Оптическое поглощение	Тонкие пленки	3.8	[19]
6	Оптическое поглощение	Synthesized by pyrolysis	4.3	[20]
7	Оптическое отражение	Synthesized by pyrolysis	5.2	[21]
9	Флюоресценция	Powder	4.02	[8]

Таблица 1 – Сравнение результатов оценки Eg в различных структурах h-BN

# Заключение

В настоящей работе были изучены процессы оптического поглощения в номинально чистых наноструктурированных порошках h-BN В GI мезографитном состоянии с индексом графитизации = 9. диффузного Экспериментальных спектры отражения были Кубелка-Мунка. В проанализированы с применением уравнения предположении прямых разрешенных переходов ширина запрещенной зоны исследуемого нанопорошка составила  $E_g = 5.41$ эВ. Показано, что наблюдаемые особенного находятся в хорошем соответствии с известными литературными данными.

# Благодарность

Данная работа поддержана Актом 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 02.А03.21.0006. С.Д.М. благодарит за финансовую поддержку стипендию Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, СП-3817.2016.1.

# Библиография

- 1. Watanabe K. Direct-bandgap properties and evidence for ultraviolet lasing of hexagonal boron nitride single crystal / K. Watanabe, T. Taniguchi, H. Kanda // Nature Materials. 2004. Vol. 3, I. 6. P. 404–409.
- Ngwenya T. B. Defect states of complexes involving a vacancy on the boron site in boronitrene / T. B. Ngwenya, A. M. Ukpong, N. Chetty // Physical Review B. - 2011. – Vol. 84, I. 15. – P. 245425.

- Museur L. Defect-related photoluminescence of hexagonal boron nitride / L. Museur, E. Feldbach, A. Kanaev // Physical Review B. – 2008. – Vol. 78, I. 15. – P. 155204–155300.
- Vokhmintsev A. S. Estimation of thermoluminescence kinetic parameters in h-BN by different techniquesResearch article / A. S. Vokhmintsev, M. G. Minin, I. A. Weinstein // Radiation Measurements. – 2017. – Vol. 106. – P. 55–60.
- Vokhmintsev A. S. Spectrally resolved thermoluminescence measurements in fluorescence spectrometer / A. S. Vokhmintsev [et al.] // Measurement. – 2015. – Vol. 66. – P. 90–94.
- 6. Spectral and kinetic features of thermoluminescence in hexagonal boron nitride powder after UV-irradiation / I. A. Weinstein [et al.] // Radiation Measurements. 2013. Vol. 56. P. 236–239.
- Henaish A. M. A. Two-Level Quenching of Photoluminescence in Hexagonal Boron Nitride Micropowder / A. M. A. Henaish, A. S. Vokhmintsev, I. A. Weinstein // AIP Conference Proceedings. – 2016. – Vol. 1717 : 4th International Conference and Exhibition on Sustainable Energy and Advanced Materials (ICE-SEAM) (Solo, 11–12 nov 2015). – Article ID 040030.
- Bandgap energy of graphite-like hexagonal boron nitride / V. L. Solozhenko [et al.] // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2001. Vol. 62, I. 7. P. 1331–1334.
- 9. Thomas J. Turbostratic boron nitride, thermal transformation to ordered -layerlattice boron nitride / J. Thomas, N. E. Weston, T. E. O'Connor // Journal of the American Chemical Society. – 1962. – Vol. 84, I. 24. – P. 4619–4622.
- Kubelka P. New contributions to the optics of intensely light-scattering materials. Pt. 1 / P. Kubelka // Journal of the optical society of America. 1948. Vol. 38, I. 5. P. 448–457.
- Light emission and excitonic effect of boron nitride nanotubes observed by photolumine scent spectra / H. Chen [et al.] // Optical materials. – 2007. – Vol. 29, I. 11. – P. 1295–1298.
- The origin of deep-level impurity transitions in hexagonal boron nitride / X. Z. Du [et al.] // Applied Physics Letters. – 2015. – Vol. 106, I. 2. – Article ID 021110.
- Zunger A. Point-defects in hexagonal boron-nitride. Pt. 2. Theoretical studies / A. Zunger, A. Katzir // Physical review B. – 1975. –Vol. 11, I. 6. – P. 2378– 2390.
- Cathodoluminescence of oxygen-vacancy centers in structures of aluminum nitride / D. M. Spiridonov [et al.] // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2015. – Vol. 79, I. 2. – P. 211–214
- Weinstein I. A. Thermoluminescence kinetics of oxygen-related centers in AlN single crystals / I. A. Weinstein, A. S. Vokhmintsev, D. M. Spiridonov // Diamond and Related Materials. – 2012. – Vol. 25. – P. 59–62.
- Yu P. Y. Fundamentals of Semiconductors: Physics and Materials Properties / P. Y. Yu, M. Cardona. 3th Ed. [S. 1.] : Springer, 2005. 662 p. (Graduate Texts in Physics).

- Grinyaev S. N. Deep levels of nitrogen vacancy complexes in graphite-like boron nitride / S. N. Grinyaev, F. V. Konusov, V. V. Lopatin // Physics of the solid state. – 2002. – Vol. 44, I. 2. – P. 286–293.
- Zunger A. Optical properties of hexagonal boron nitride / A. Zunger, A. Katzir, A. Halperin // Physical Review B. – 1976. – Vol. 13, I. 12. – P. 5560–5573.
- Rand M. J. Preparation and Properties of Thin Film Boron Nitride / M. J. Rand, J. F. Roberts // Journal of The Electrochemical Society. – 1968. – Vol. 115, I. 4. – P. 423–429.
- Zupan J. Optical properties of graphite and boron nitride / J. Zupan, J. D. Kolar // Journal of Physics C: Solid State Physics. – 1972. – Vol. 5, I. 21. – P. 3097– 3100.
- Hoffman D. M. Optical properties of pyrolytic boron nitride in the energy range 0.05—10 eV / D. M. Hoffman, G. L. Doll, P. C. Eklund // Physical Review B. – 1984. – Vol. 30, I. 10. – P. 6051–6056.